

國立交通大學

電子工程學系電子研究所

博士論文

先進閘極介電層互補式金氧半電晶體中  
電壓溫度引致不穩定性之研究



**Bias Temperature Instability in CMOSFETs  
with Advanced Gate Dielectrics**

研究生：詹前泰

指導教授：汪大暉 博士

中華民國九十五年三月

先進閘極介電層互補式金氧半電晶體中  
電壓溫度引致不穩定性之研究

**Bias Temperature Instability in CMOSFETs  
with Advanced Gate Dielectrics**

研究生：詹前泰

Student : Chien-Tai Chan

指導教授：汪大暉 博士

Advisor : Dr. Tahui Wang



Submitted to Department of Electronics Engineering &  
Institute of Electronics

College of Electrical and Computer Engineering

National Chiao Tung University

in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of Doctor of Philosophy

in

Electronics Engineering

March 2006

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國九十五年三月